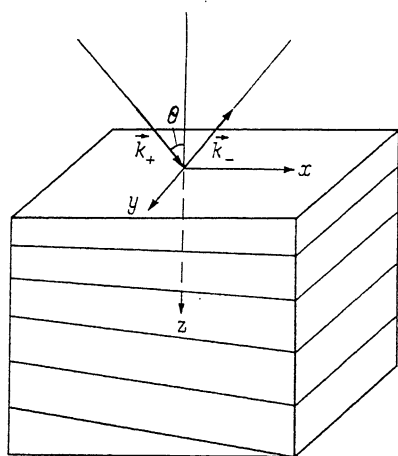


К ТЕОРИИ СУПЕРЗЕРКАЛ РЕНТГЕНОВСКОГО ДИАПАЗОНА

А. С. Мельников, А. А. Фраерман

В настоящее время в качестве отражающих селективных элементов рентгенооптики широко используются многослойные периодические структуры [1]. В ряде случаев, однако, возникает необходимость создания широкополосных устройств с заданной спектральной характеристикой или зеркал с большим интегральным коэффициентом отражения. В нейтронной оптике для этих целей используются структуры с меняющимся периодом [2], получившие название суперзеркала. Решение вопроса о целесообразности использования суперзеркал для рентгеновского излучения требует дополнительного анализа в связи с наличием поглощения. Спектральные характеристики суперзеркал для рентгеновского излучения на длинах волн ~ 8 и 23.6 \AA экспериментально изучались в работе [3], где рассмотрены два возможных варианта изменения периода: зеркала с периодом, меняющимся вдоль нормали к входной поверхности и перпендикулярно этой нормали. В дальнейшем мы будем называть их z -зеркало и x -зеркало соответственно (см. рисунок). Однако достаточное теоретическое



рассмотрение таких зеркал в [3] отсутствует. Целью работы является аналитический расчет отражательных характеристик суперзеркал в рентгеновском диапазоне длин волн и определение возможностей использования таких структур. Рассмотрим распространение электромагнитного излучения в среде с квазипериодической диэлектрической проницаемостью

$$\varepsilon(x, y, z) = 1 + a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nq(x, y, z)z), \quad (1)$$

где a_n — амплитуды разложения диэлектрической проницаемости в ряд Фурье структуры с постоянным периодом. При этом предполагается, что соотношение толщины пленок, составляющих период, не зависит от координат, а $q(x, y, z)$ — медленная функция координат

$$a_0 = (\varepsilon_1 - 1)\beta + (\varepsilon_2 - 1)(1 - \beta), \quad a_n = 2 \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\pi n} \sin(\pi n \beta),$$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ — комплексные диэлектрические проницаемости веществ, составляющих зеркало; β — отношение толщины одного из слоев к периоду. Учитывая, что в рентгеновском диапазоне длин волн диэлектрическая проницаемость всех веществ близка к единице, для амплитуд встречных волн имеем систему укороченных уравнений

$$i(\mathbf{k}_+, \nabla) E_+ = \frac{k_0^2}{2} \left(a_0 E_+ + \frac{a_1}{2} E_- e^{2i\Delta z} \right), \quad (2)$$

$$i(\mathbf{k}_-, \nabla) E_- = \frac{k_0^2}{2} \left(a_0 E_- + \frac{a_1}{2} E_+ e^{-2i\Delta z} \right), \quad (3)$$

где $\mathbf{k}_{\pm}, E_{\pm}$ — волновые векторы и амплитуды падающей и отраженной волн. Расстройка Δ зависит от координат и равна

$$\Delta(x, y, z) = k_0 \cos \theta - q(x, y, z)/2,$$

θ — угол падения (см. рисунок). Система уравнений (2), (3) получена для z -поляризации падающей волны без учета изменения поляризации излучения при его распространении в глубь структуры. Граничные условия для уравнений (2), (3)

$$E_+(x, y, 0) = 1, \quad E_-(x, y, L) = 0, \quad (4)$$

L — длина зеркала вдоль z .

Рассмотрим x -зеркало, для которого q не зависит от z . Разложим $q(x, y)$ в ряд Тейлора в точке (x_0, y) с точностью до квадратичных членов

$$q(x, y) = q(x_0, y) = \frac{\partial q(x_0, y)}{\partial x} \xi + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 q(x_0, y)}{\partial x^2} \xi^2.$$

Условие того, что в разложении фазы $\Delta(x, y, z)$ можно ограничиваться линейными членами по ξ выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{q} \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \Big|_{x_0, y} N_{\text{эфф}} L_x^2 \ll 1, \quad (5)$$

$N_{\text{эфф}}$ — число эффективно отражающих периодов; L_x — область x , оказывающая существенное влияние на отражение в точке (x_0, y) . Учтем, что

$$L_x \sim \frac{1}{q} \text{tg } \theta N_{\text{эфф}},$$

и перепишем (5)

$$\frac{1}{q^3} \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \Big|_{x_0, y} N_{\text{эфф}}^3 \text{tg}^2 \theta \ll 1.$$

Если (5) выполнено, то можно получить точное решение системы (2), (3). Используя замену

$$E_- = V \exp \left\{ \frac{i \text{ctg } \theta}{(\partial q / \partial x)_{x_0, y}} \left(\Delta(x_0, y) - \frac{1}{2} \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{x_0, y} (\xi + z \text{tg } \theta) \right)^2 \right\}, \quad (6)$$

для $V(x, y, z)$ получим дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами, которые можно решать, используя, например, фурье-преобразование по x . Тогда амплитуда отраженной волны в плоскости $z=0$ имеет вид

$$E_-(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\delta) G(\delta, x, y) d\delta, \quad (7)$$

где

$$\rho(\delta) = \frac{k_0 a_1}{4 \cos \theta} \frac{\text{tg}(\sqrt{\delta + k_0 a_0 / 2 \cos \theta}^2 - (k_0 a_1 / 4 \cos \theta)^2 L)}{\delta \text{tg}(\sqrt{\delta + k_0 a_0 / 2 \cos \theta}^2 - (k_0 a_1 / 4 \cos \theta)^2 L) + \sqrt{\left(\frac{k_0 a_1}{4 \cos \theta}\right)^2 - \left(\delta + \frac{k_0 a_0}{2 \cos \theta}\right)^2}}$$

— коэффициент отражения от структуры с постоянным периодом,

$$G(\delta, x, y) = \frac{1}{\sqrt{-i2\pi\gamma}} \exp \left\{ -\frac{(\delta - \delta_0)^2}{-2i\gamma} \right\},$$

$$\gamma = \frac{\partial q}{\partial x} \text{tg } \theta, \quad \delta_0 = k_0 \cos \theta - \frac{q(x, y)}{2}.$$

Если выполняется

$$N_{\text{эфф}} \sqrt{\frac{1}{q^2} \frac{\partial q}{\partial x} \text{tg } \theta} \ll 1, \quad (8)$$

то

$$E_-(x, y, z=0) = \rho(\delta_0). \quad (9)$$

Сделаем оценки. Для простейшего закона изменения периода

$$d = d_0 + \kappa x \quad (10)$$

и $N_{\text{эфф}} \sqrt{\frac{1}{q^2} \frac{\partial q}{\partial x} \text{tg } \theta} \sim 10^2$, $\text{tg } \theta \sim 1$, $\kappa \sim 0.1$ (d_0/D) $\sim 10^{-7}$ (D — размер зеркала по оси x) условие (9) заведомо выполняется. Коэффициент отражения от x -зеркала площади S есть

$$R = \frac{1}{S} \iint_S |E_-(x, y)|^2 dx dy,$$

а интегральный (по частотам) коэффициент отражения

$$R_i = \int_{-\infty}^{\infty} R(k_0) dk_0.$$

Используя (7), можно показать, что рассматриваемый вариант суперзеркала не дает увеличения интегрального коэффициента отражения по сравнению с зеркалом без изменения периода. Если для $E_-(x, y)$ справедливо выражение (8), то результат становится очевидным, так как в этом случае суперзеркало представляет собой набор независимых зеркал с постоянным периодом. Ясно также, что ширина спектральной линии увеличивается на величину порядка $\lambda D \cos \theta$ (для закона (10)), причем коэффициент отражения в этой области длин волн практически постоянен и равен

$$R = R_0 \frac{d_0}{\lambda D} \frac{1}{N_{\text{эфф}}}, \quad (11)$$

R_0 — коэффициент отражения от структуры с постоянным периодом в максимуме. Для приведенных выше параметров суперзеркала $R \sim 0.1 R_0$.

Рассмотрим z -зеркало, для которого q зависит только от z . В кинематическом приближении получим следующее выражение для интегрального коэффициента отражения:

$$R_{i \text{ кин}} = \frac{\pi}{L_{\text{ex}} \cos \theta} \frac{L}{L_{\text{ex}}} \frac{1 - e^{-l/l}}{L/l} \left[1 + \left(\frac{a_{1i}}{a_{1r}} \right)^2 \right], \quad (12)$$

где

$$L_{\text{ex}} = \left(\frac{k_0 a_{1r}}{4 \cos \theta} \right)^{-1}, \quad l = \left(\frac{2k_0 a_{0i}}{\cos \theta} \right)^{-1},$$

$$a_{1r} = \text{Re } a_1, \quad a_{1i} = \text{Im } a_1, \quad a_{0i} = \text{Im } a_0. \quad (13)$$

При этом не учитывается зависимость оптических констант от длины волны. Видно, что $R_{i \text{ кин}}$ не зависит от закона изменения периода. Аналогичный результат для деформированных кристаллов был получен в работе [4]. Для справедливости кинематического приближения, например, в случае линейного закона изменения периода ($d = d_0 + dz$) достаточно

$$\frac{d_0}{L_{\text{ex}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\alpha}} \ll 1. \quad (14)$$

Отношение $R_{i \text{ кин}}$ к интегральному коэффициенту отражения для зеркала с постоянным периодом R_{i0} в случае отсутствия поглощения есть

$$\frac{R_{i \text{ кин}}}{R_{i0}} = \frac{L/L_{\text{ex}}}{\text{th } L/L_{\text{ex}}}. \quad (15)$$

Это максимально возможный выигрыш в интегральном коэффициенте отражения для суперзеркала без поглощения. С учетом поглощения можно также оценивать эффективность суперзеркала, сравнивая $R_{i \text{ кин}}$ с интегральным коэффициентом отражения для зеркала с постоянным периодом при $L \rightarrow \infty$, приведенным в [5]. Такая оценка показывает, например, что если $\text{Im } \varepsilon_1 \ll \text{Im } \varepsilon_2$, то при

$$\left| \frac{\text{Im } \varepsilon_1}{\text{Re } (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \right| \geq \frac{1}{6}$$

нельзя получить выигрыш в R_i более чем в два раза. Сравнение, естественно, предполагает предварительную оптимизацию по параметру β .

Таким образом, существует возможность использования x -зеркала для управления формой спектральной характеристики без увеличения интегрального коэффициента отражения. Увеличение R_i может быть достигнуто с помощью z -зеркала. R_i будет максимален при достаточно быстром изменении периода, когда справедливо кинематическое приближение. Причем $R_{i \text{ кин}}$ не зависит от закона изменения периода и ограничен лишь наличием поглощения. Приведенные оценки позволяют определить влияние поглощения на работу z -зеркала.

Авторы благодарят С. В. Гапонова, В. М. Генкина, Н. Н. Салащенко за полезные замечания и интерес к работе.

Литература

- [1] Гапонов С. В., Гусев С. А., Платонов Ю. Я., Салащенко Н. Н. ЖТФ, 1984, т. 54, № 4, с. 747—753.
 [2] Mezei F. Com. on Physics, 1976, v. 1, p. 81—85.

- [3] Lee Ping. Appl. Optics, 1983, v. 22, p. 1241—1246.
 [4] Afanasev A. M., Kovalchuk M. V., Kovev E. K., Kohn V. G. Phys. St. Solidi(a), 1977, v. 42, N 1, p. 415—422.
 [5] Пинскер Э. Г. Рентгеновская кристаллооптика. М.: Наука, 1982.

Институт прикладной физики
 АН СССР
 Горький

Поступило в Редакцию
 5 февраля 1987 г.

УДК 621.315.592

Журнал технической физики, т. 58, в. 5, 1988

УПРУГИЕ, ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИДА КАДМИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

И. Б. Кобяков, В. М. Арутюнова

Сульфид кадмия — полупроводниковый пьезоэлектрик группы $A^{II}B^{VI}$ — характерен удачным сочетанием целого ряда свойств. Он обладает кристаллической структурой вюрцита, которая описывается пространственной группой C_{6v}^4 и точечной группой C_{6v} . Этот материал обладает большим значением коэффициентов электромеханической связи, темного удельного сопротивления и подвижности электронов, высокой фоточувствительностью, хорошими прочностными механическими и электрическими свойствами, что обусловило его широкое применение в различного типа электромеханических преобразователях. Экспериментальные данные по определению упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических постоянных сульфид кадмия приведены во многих работах. В [1, 2] определены все упругие жесткости импульсным ультразвуковым методом с погрешностью, не превышающей 0.2 %. В [3] измерены упругие податливости s_{ij} , а в [4] — значения пьезомодулей d_{ij} и их знаки. В [5] методом резонанса—антирезонанса определен полный набор упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических постоянных монокристаллов сульфид кадмия, полученных из газовой фазы. В [6] также определен полный набор постоянных на кристаллах, выращенных из расплава. В [7] приведены температурные зависимости упругих жесткостей c_{ij} в интервале температур 4.2—300 К, а в [8] — температурные зависимости упругих податливостей s_{11}^E и s_{12}^E , диэлектрических проницаемостей ϵ_{33}^T и ϵ_{11}^T и пьезомодуля d_{31} в интервале температур 1.5—300 К. Результаты, полученные в перечисленных работах, не всегда согласуются между собой. Это можно объяснить как несовершенством методик измерения, так и низким качеством исследованных кристаллов. Последнее обстоятельство особенно сильно влияет на величину добротности, а также на пьезоэлектрические постоянные и соответствующие им коэффициенты электро-механической связи.

В данной работе приведен полный набор упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических постоянных CdS при комнатной температуре с целью оценки перспективности использования этого материала в различных типах пьезоэлектрических преобразователей. Исследованные нами монокристаллы были получены из газовой фазы. Выращивание производилось в интервале температур 1170—1200 °С в контейнере из кварцевого стекла особой чистоты на затравку, ориентированную в плоскости (0001). Скорости роста составляли 0.4—0.6 мм/ч. Выращенные монокристаллы имели форму буль диаметром до 50 мм и высотой до 40 мм. Они были светло-желтого или желтого цвета. Плотность дислокаций составляла $\approx 10^2$ см⁻². Образцы имели темновое удельное сопротивление $\rho_T \approx 10^9$ Ом·см. Для улучшения стехиометрии и однородности образцы подвергались высокотемпературному отжигу в парах серы, после чего их темновое удельное сопротивление повышалось до 10^{11} Ом·см. Плотность монокристаллов, определенная методом гидростатического взвешивания, оказалась равной 4824.0 ± 0.2 кг/м³.

Симметрия сульфид кадмия определяет наличие у него пяти независимых упругих постоянных: $s_{11}=s_{22}$, s_{33} , s_{12} , $s_{13}=s_{23}$, $s_{44}=s_{55}$; трех пьезоэлектрических постоянных: $d_{31}=d_{32}$, $d_{15}=d_{24}$, d_{33} ; двух диэлектрических проницаемостей: $\epsilon_{11}=\epsilon_{22}$, ϵ_{33} . Возбуждаемые моды колебаний для определения соответствующих постоянных, измеряемые величины и пересчетные формулы аналогичны описанным в [9]. Измерения проводились в темноте при комнатной температуре.